金属(Ti, Ni)/(0001)Al~2O~3界面电子结构的光电子能谱研究

刘韩星,张汉林,任海兰,欧阳世翕,王典芬

武汉工业大学新材料研究所;武汉工业大学测试中心

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 采用离子减薄结合X射线光电子能谱方法原位对金属-陶瓷界面的电子结构进行研究, 其结果表明在界面处,对Ti/Al~2O~3体系,有氧化态的Ti,同时发现部分的Al^3^+被还原;对Ni/Al~2O~3体系, 在经退火处理后,界面处Ni有多种结合态存在。本文结果与理论分析相一致, 对其它的实验结果给予了较好的解析。

关键词 镍 氧化铝 钛 电子结构 光电子谱法 其它基金 金属-陶瓷界面

分类号 0647

Study on the electronic structure of (Ti, Ni)/(0001)Al~2O~3 interfaces by XPS

LIU HANXING, ZHANG HANLIN, REN HAILAN, OUYANG SHIXI, WANG DIANFEN

Abstract The electronic structure of Ti, Ni/Al~2O~3 interfaces were studied by X-ray photoelectron spectra (XPS) in situ during sputtering. The experiment results show that in the interface area, for Ti/Al~2O~3, Ti was oxidated and Al^3^+ was reduced; for Ni/Al~2O~3, Ni has several oxidation states including the spinel.

 Key words
 NICKEL
 ALUMINIUM OXIDE
 TITANIUM
 ELECTRONIC STRUCTURE
 PHOTOELECTRON

 SPECTROSCOPY

DOI:

通讯作者

扩展功能

本文信息

- ► Supporting info
- ▶ **PDF**(0KB)
- ▶[HTML全文](0KB)
- ▶参考文献

服务与反馈

- ▶把本文推荐给朋友
- ▶加入我的书架
- ▶加入引用管理器
- ▶复制索引
- ► Email Alert
- ▶文章反馈
- ▶浏览反馈信息

相关信息

- ▶ 本刊中 包含"镍"的 相关文章
- ▶本文作者相关文章
- 刘韩星
- 张汉林
- 任海兰
- 欧阳世翕
- 王典芬